

FE-SEM(SU6600)の実施例

FE-SEM：電界放出型 走査型電子顕微鏡

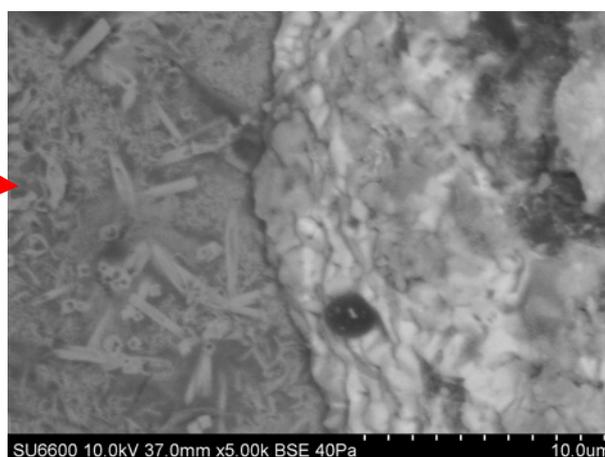
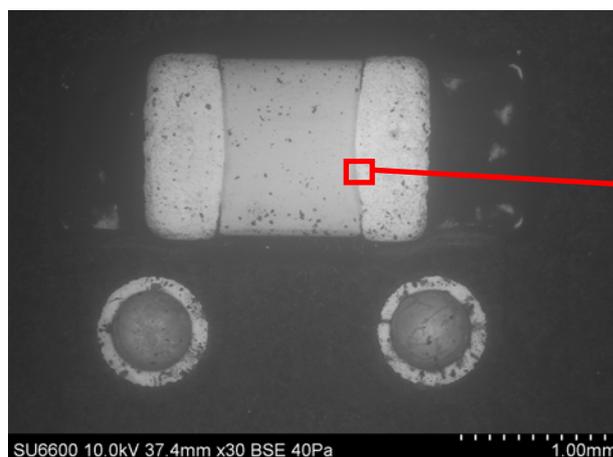
サンプル：電子部品

特 徴：絶縁物である電子部品を、無蒸着で観察 高倍観察も可能
 大きなサンプルも切断なしで観察
 (最大サイズ：150mm × 20mm 質量：260g)

外観写真



反射電子像



測定条件：加速電圧 10 kV
 低真空モード 40 Pa